

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15021-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 05.12.2023

Ausstellungsdatum: 05.12.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

**Oelze Präzisions-Meßzeugfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Bollenwaldstraße 112, 63743 Aschaffenburg**

mit dem Standort

**Oelze Präzisions-Meßzeugfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Bollenwaldstraße 112, 63743 Aschaffenburg**

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- **Ebenheit** ^{a)}
- **Geradheit** ^{a)}

Winkel

- **Winkelnormale**

^{a)} auch als Vor-Ort-Kalibrierung

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15021-01-00

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Länge Ebenheit Horizontale Ebenheits- verkörperungen	bis 30 µm	bis 10 m Kantenlänge QSH, Anhang A1:2023-03	$1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = Kantenlänge der Ebenheitsverkörperung z.B. Prüfplatten nach DIN 876:1984
Geradheit Horizontale Geradheits- verkörperungen	bis 30 µm		$1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = Kantenlänge der Geradheitsverkörperung
Winkel 90° -Winkel Rechtwinkligkeits- normale mit ebenen Flächen	bis 30 µm	bis 1000 mm Kantenlänge QSH, Anhang A2:2023-03	1,6 µm / m	
Winkel Winkelplatte mit vier 90°-Winkeln		bis 1000 mm Kantenlänge QSH, Anhang A2:2023-03	2,4 µm / m	

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Länge Ebenheit Horizontale Ebenheits- verkörperungen	bis 30 µm	bis 10 m Kantenlänge QSH, Anhang A1:2023-03	$1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = Kantenlänge der Ebenheitsverkörperung z.B. Prüfplatten nach DIN 876:1984
Geradheit Horizontale Geradheits- verkörperungen	bis 30 µm		$1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = Kantenlänge der Geradheitsverkörperung

Verwendete Abkürzungen:

- DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
- EN Europäische Norm
- IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
- ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung
- QSH Kalibrierverfahren der Oelze Präzisions-Meßzeugfabrik GmbH